

專家
開講

半導體及通訊電子產品雜訊測試研討會

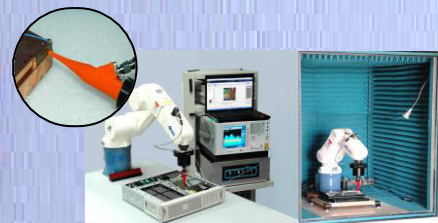
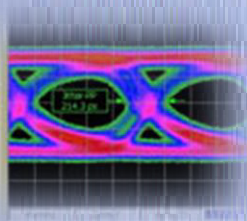
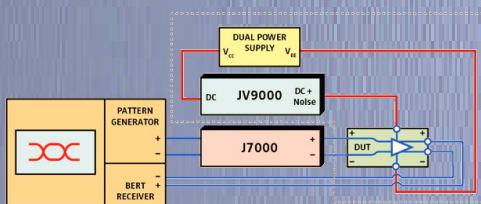
5G/B5G, MPE, EMI/EMC, ESD, HAC, Noise Test

12/14

因應傳輸量快速增加，高速數位傳輸測試已成為未來最矚目的通訊技術，如資料中心、AI、NB、HPC等新應用不斷推出，而其中雜訊的檢測在高頻環境下更是重要。

筑波科技與合作夥伴APREL、Noisecom 攜手舉辦一場充滿突破創新的研討會，致力高速數位IC (HDMI、USB、Type-C、PCIE、SATA、DDR4/5/6) 的雜訊干擾、電源跳動介面干擾、Jitter(抖動)……等，探討和解決當今電子通訊領域的關鍵雜訊干擾測試，聚焦在最佳EMI/ESD/EMS、隔離度分析、音頻/射頻助聽兼容、5G功率密度測量、雜訊失效報告量測分析方案、雜訊干擾測試，更是IC設計及驗證在各種環境條件的穩定工作的重要課題。

這是一個重要的科技盛事，誠摯邀請您與筑波科技專業團隊就市場和技術的最新趨勢探討及交流！歡迎產業領域：IC設計、高速數位傳輸、5G/B5G、低軌道衛星、WiFi晶片設計、PCB、汽車零件/模組、電動車模組、電池充電器管理板設計、等專案開發經理、工程師與主管們報名參加。



Time

Topic

Speaker

PM 12:30~13:30	報到登記 Registration	
13:30~13:40	歡迎致詞 Welcome	筑波科技 許棟材 行銷副總 Tony Hsu, Market VP, ACE Nicol Stuart, CEO, APREL Roger Fayad, International Sales Director, WTG
13:40~13:50	高速數位傳輸市場趨勢與機會 5G/B5G/LEO/HSDI Market Overview	筑波科技 李凱傑 行銷經理 Peter Lee, Market Manager, ACE
13:50~14:30	EMI挑戰與解決方案 EMI Challenge & Solutions	Nicol Stuart CEO, APREL
14:30~15:10	5G/B5G 功率密度測量 5G/B5G Power density Measurement	Maryna Nesterova R&D Senior Engineer, APREL
15:10~15:30	Break	
15:30~16:00	Noise Test Solutions for HSDI IC / modules and Wireless 高速數位IC 模組及無線通訊的雜訊測試應用	James Lim Applications Engineer Wireless Telecom Group
16:00~16:40	方案展示參觀 Demo Station Show • EMI-Sight Life Demo & QA –APREL • 高速數位/類比IC雜訊混波測試方案 –Noisecom • PA Test Solution –ACE • Introduction to Instrument Rental Services– ACE Rentek	
16:40~17:00	5G 行動通訊測試解決方案 5G FR1/FR2 Test Solution	筑波科技 趙英治 資深技術經理 Eden Chao, Sr. Tech. Manager, ACE
17:00~17:10	Q&A	

日期 Date

2023年12月14日 (四) PM12:30 – PM17:10

地點 Location

筑波醫電大樓1F 諾貝爾講堂 (新竹縣竹北市生醫二路66號-新竹生醫園區)

線上報名

Registration

03-5500909 蔡小姐#3800 / 林小姐#3407

https://register.acesolution.com.tw/20231214_5GB5GNoise_Seminar
service@acesolution.com.tw



掃碼報名



筑波科技股份有限公司
ACE.Solution Co.,Ltd.



歡迎加我
LINE ME
需求詢問